

# 外側マイクロメータの JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。※

※ JCSS校正のみ該当

## ■ 対象測定器

外側マイクロメータ



画像提供：(株)ミットヨ

## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )	
		恒久的施設校正	巡回校正 (出張校正)
恒久的施設校正 及び 巡回校正 (出張校正)	25 mm 以下	2 $\mu$ m	3 $\mu$ m
	25 mm 超過 50 mm 以下	2 $\mu$ m	4 $\mu$ m
	50 mm 超過 75 mm 以下	3 $\mu$ m	6 $\mu$ m
	75 mm 超過 100 mm 以下	4 $\mu$ m	8 $\mu$ m

端子構造によって、校正できない場合があります。

巡回校正 (出張校正) もご対応しております。

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 外側マイクロメータ (50 mm以下) 1個 の場合 (セット校正)  
料 金 2,400 円 (校正証明書を含む。税別)



## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : http://www.jemic.go.jp